

证书号第4518764号



发明专利证书

发明名称：一种应用于无线层析成像系统的降质函数的估计方法

发明人：高飞；孙成；傅一文；王继勇；刘珩；安建平；许胜新

专利号：ZL 2017 1 0021570.2

专利申请日：2017年01月12日

专利权人：北京理工大学

地址：100081 北京市海淀区中关村南大街5号

授权公告日：2021年06月29日

授权公告号：CN 106940895 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



证书号 第4518764号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 01 月 12 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

北京理工大学

发明人：

高飞, 孙成, 傅一文, 王继勇, 刘珩, 安建平, 许胜新